

プラチナマスク試験書

1 試験実施日 平成 31 年 3 月 15～平成 31 年 3 月 18 日

2 試料名

試料① : AIRPLOT プラチナマスクにスギ花粉を固定し、紫外線照射なし

試料② : AIRPLOT プラチナマスクにスギ花粉を固定し、紫外線を 2 時間照射

計 2 点

3 使用試験機 走査型電子顕微鏡 ((株)日立製作所製 S-3700N)

4 試験方法 試料について、走査型電子顕微鏡を用いて 750 倍および 2,000 倍の二次電子像を

撮影した。試験時室温 : 20.8℃

次ページに続く

6 試験結果 図1~4に結果を示す。

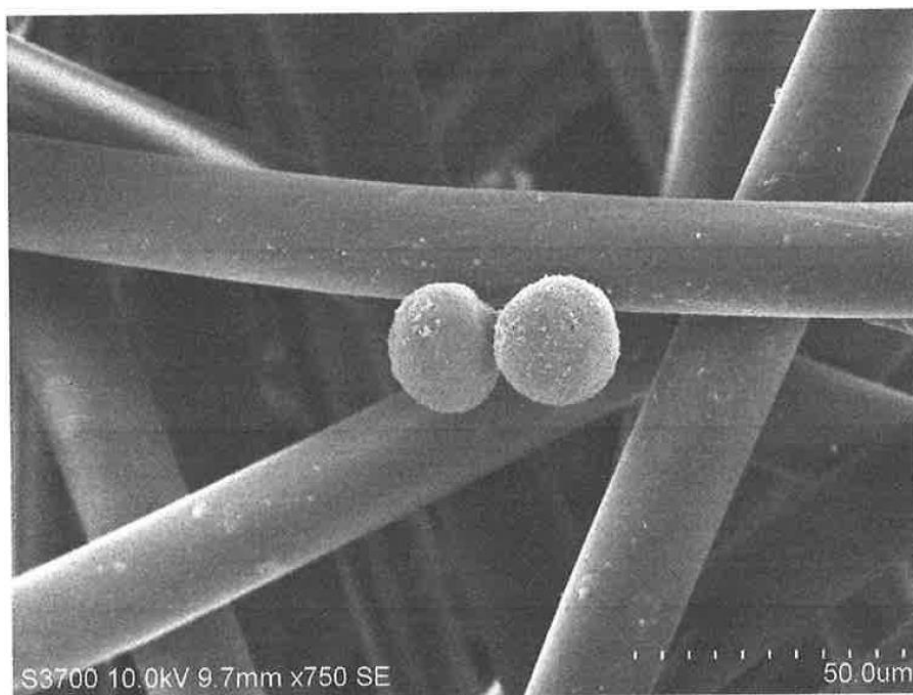


図1 試料①：二次電子像（750倍）

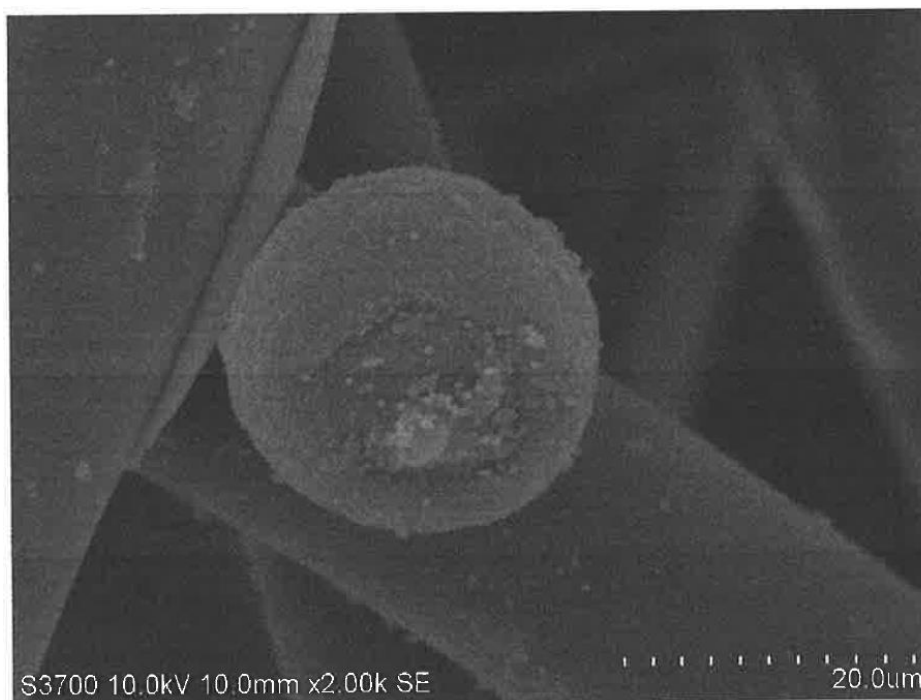


図2 試料①：二次電子像（2,000倍）

次ページに続く

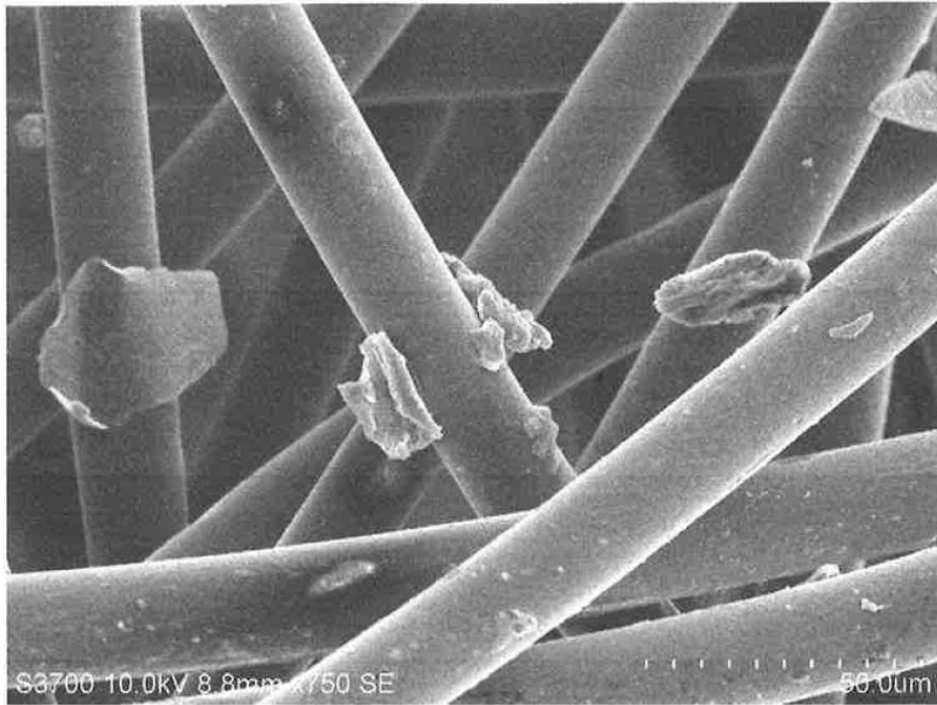


図3 試料②：二次電子像（750倍）

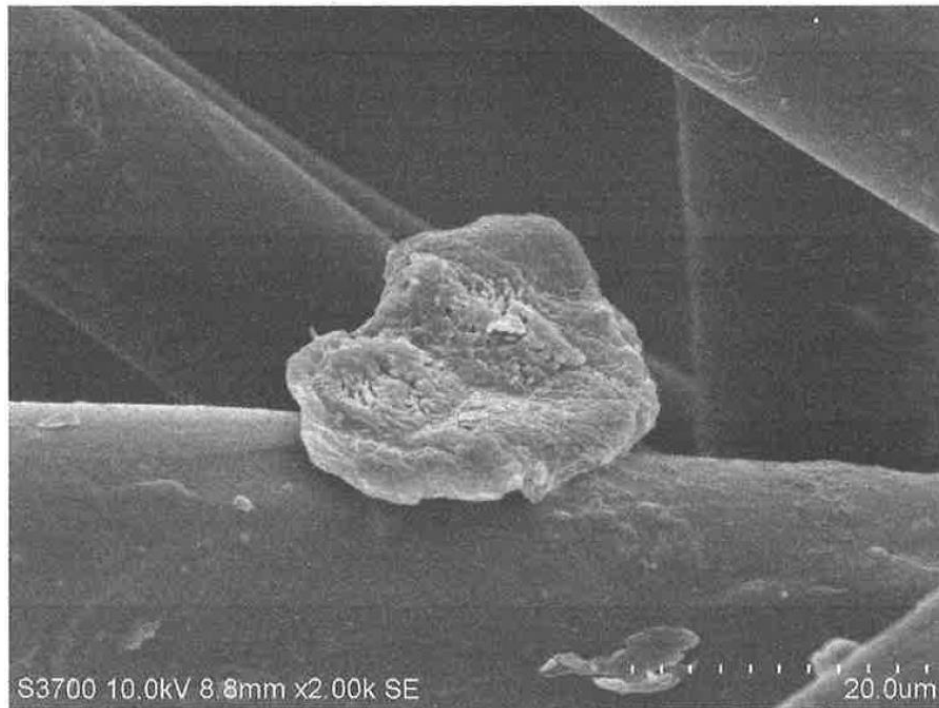


図4 試料②：二次電子像（2,000倍）

以下余白